

СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТЫЛЬНЫХ КОНТАКТОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ AI, МОДИФИЦИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЕМ Mo В УСЛОВИЯХ ИОННОГО АССИСТИРОВАНИЯ

¹Бобрович О.Г., ²Барайшук С.М.*[,] ³Туравец А.И., ³Михалкович О.М.

¹БГТУ. Ул. Свердлова, 13а, Минск, Беларусь. 220006.

² БГАТУ. Пр. Независимости, 99. Минск, Беларусь. 220023.

³ БГПУ им. М. Танка. Ул. Советская, 18. Минск, Беларусь. 220050

**bear_s@rambler.ru*

Возможность использования гибких металлических подложек для осаждения солнечных фотопреобразователей на ограничены тем, что эффективность таких конструкций на несколько процентов ниже, чем на стеклянных подложках с предварительно осажденным проводящим тыльным слоем, что связано с диффузией примесей из металлических подложек [1–3] и их шероховатостью [4]. Поэтому исследование шероховатости поверхности материалов применимых для промышленной технологии производства фотоэлементов играет важную роль в повышении их эффективности и себестоимости.

Ранее было изучено влияние типа подложки (стеклянная подложка с подслоем молибдена, фольги из Mo и Ta) на морфологию поверхности тонких пленок Cu₂ZnSnSe₄, полученных электрохимическим осаждением с последующей селенизацией [5–6]. В данной работе изучали закономерности влияния подложки и режимов нанесения Mo покрытия на смачивание поверхности алюминиевого сплава AMg2M и морфологию его поверхности. Модификация поверхности осуществлялась осаждением молибдена в условиях ионного ассистирования при ускоряющем напряжении U = 3, 6, 9, 12 и 15 кВ для ассистирующих ионов Mo⁺ и интегральных потоках ионов 1,1·10¹⁷ – 2,1·10¹⁷ Mo⁺/см². В рабочей камере в процессе создания покрытий поддерживался вакуум при давлении ~1 · 10⁻² Па. Морфология поверхности исходных и модифицированных образцов изучалась, используя атомно-силовую микроскопию в контактном режиме (атомно-силовой микроскоп NT-206, зонды CSC21) обработка полученных изображений проводилась в соответствии с методикой описанной в [7]. Смачивание исходных и модифицированных образцов сплава AMg2M дистиллированной водой определяли по равновесному краевому углу Θ смачивания.

Покрытия Mo наносились на сплав AMg2M с использованием резонансного ионного источника вакуумной электродуговой плазмы. Данный источник создает плазму вакуумного электродугового разряда, в которой одновременно генерируются положительные ионы и нейтральная фракция из материала электродов источника ионов. Выбранные значения ускоряющего напряжения для ассистирующих ионов Mo⁺ позволяют получить различие в плотности выделяющейся энергии в каскаде атомных столкновений в сплаве AMg2M при его модификации. Расчетные значения плотности выделенной энергии для выбранной системы Mo/сплав AMg2M приведены в таблице 1.

Таблица 1. Плотность энергии, выделяющейся в каскаде атомных столкновений

U, кВ	3	6	9	12	15
ПВЭ, эВ/атом	1,58	0,79	0,53	0,40	0,32

Характеристики поверхности исходного сплава AMg2M и сплава с нанесенным Mo покрытием представлены в таблице, а изображения топографии поверхности приведены на рисунок 1. Средняя шероховатость исходного образца сплава AMg2M составляла 34,3 нм и снижалась при увеличении ускоряющего напряжения для ассистирующих ионов Mo⁺ до 7,8

нм при $U=12$ кВ и 9,9 нм при $U=15$ кВ. При внедрении сравнимых доз ионов молибдена в образцы сплава с увеличением ускоряющего напряжения значения равновесного краевого угла смачивания также увеличиваются (таблица 2).

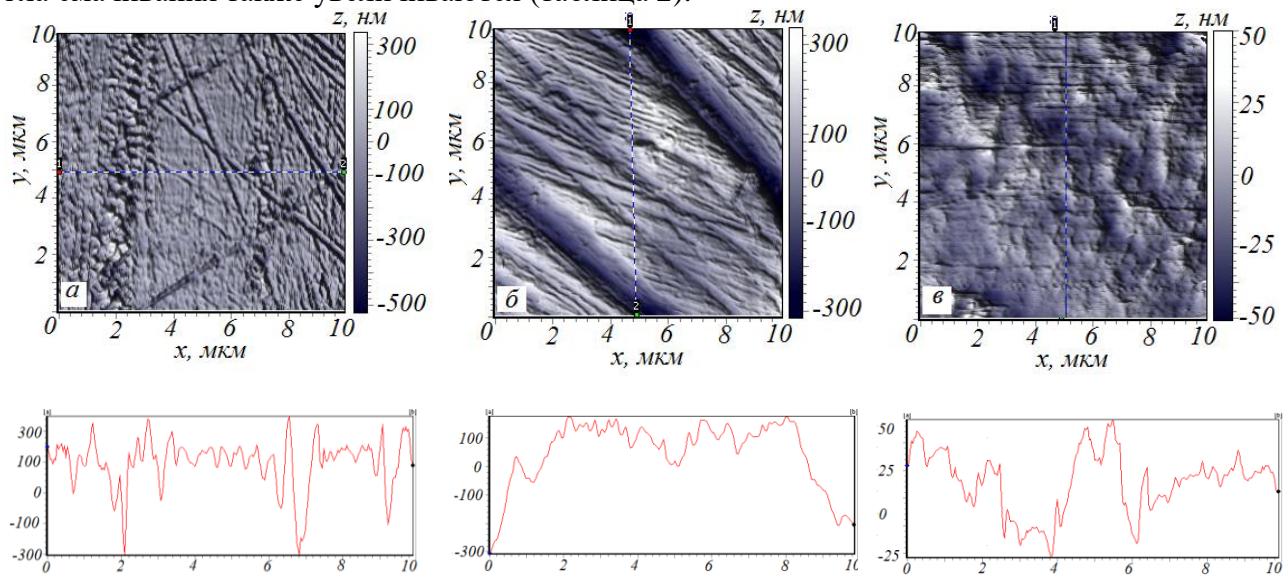


Рисунок 1. Топография и профиль сечения поверхности сплава АМг2М: а – исходный и модифицированной осаждением Mo в условиях ионного ассистирования б – при $U=3$ кВ; в – при $U=15$ кВ.

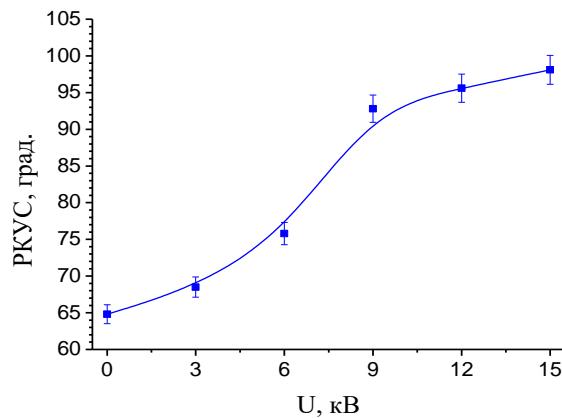


Рисунок 2. Зависимость краевого угла смачивания дистиллированной водой поверхности сплава АМг2М от ускоряющего напряжения для ассистирующих ионов Mo^+ .

Таблица 2. Параметры морфологии и смачиваемости поверхности сплава АМг2М до и после модификации нанесением Mo пленки в условиях иного ассистирования

Ион	U, kV	$\Theta, \text{град.}$	$R_a, \text{нм}$	$R_q, \text{нм}$	$Z, \text{нм}$
–		64,8	34,33	48,29	655,78
Mo^+	3	68,5	15,52	20,99	310,86
	6	75,8	–	–	–
	9	92,8	11,03	15,17	187,24
	12	95,6	7,77	10,35	138,24
	15	98,1	9,88	14,89	181,63

Исходная поверхность сплава была гидрофильной ($\Theta = 64,8^\circ$) и оставалась гидрофильной после модификации при $U = 3$ и 6 кВ. После модификации сплава при

ускоряющем потенциале $U = 9, 12, 15$ кВ поверхность стала гидрофобной и значение краевого угла смачивания увеличилось до $\Theta = 98,1^\circ$ при ускоряющем напряжении 15 кВ.

Установлено, что влияние плотности выделенной энергии на смачиваемость поверхности модифицированного образца сплава AMg2M противоположно зависимости равновесного краевого угла смачивания дистиллированной водой от ускоряющего напряжения. Так с увеличением плотности выделенной энергии значения равновесного краевого угла смачивания уменьшаются.

Для уменьшения шероховатости поверхности сплава AMg2M при нанесении Mo покрытия преобладающим является ускоряющее напряжение для ассирирующих ионов Mo^+ . На рисунке 3 показана зависимость средней шероховатости модифицированного образца сплава AMg2M от ускоряющего напряжения для ассирирующих ионов Mo^+ .

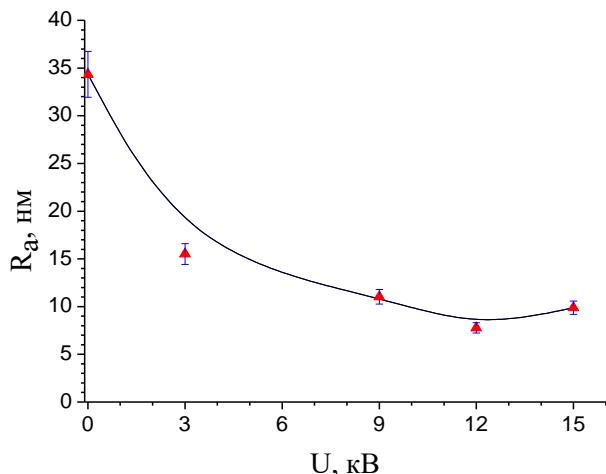


Рисунок 3. Зависимость средней шероховатости образца сплава AMg2M от ускоряющего напряжения для ассирирующих ионов Mo^+

Из анализа полученных данных можно предположить, что на шероховатость модифицированных образцов сплава AMg2M существенное воздействие оказывает ускоряющее напряжение для ассирирующих нанесение молибдена ионов Mo^+ . Начиная с ускоряющего напряжения 9 кВ средняя шероховатость поверхности модифицированного образца уменьшается более чем в три раза и приближается к значениям для подложек Mo/стекло и Mo-фольга изученным ранее [5–6]. Таким образом, показанная возможность управления шероховатостью поверхности позволяет использовать Al подложки с нанесенным покрытием как альтернативу подложкам Mo/стекло Mo-фольга для формирования солнечных элементов.

- [1] W. K. Batchelor [et al.] // Solar En. Mat. and Solar Cells. – 2004. – Vol. 83. – P. 67–80.
- [2] T. Satoh [et al.] // Proc. of the 28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, – Anaheim, CA, 2000. – P. 567–570.
- [3] G. San Vicente [et al.] // Proc. of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, – London, UK, 2001. – P. 638–642.
- [4] Batchelor, W. K.// Proc. of the 29th IEEE Photovoltaics Specialist's Conference, – New Orleans, LA, 2002. – P. 719–719.
- [5] С.М. Барайшук, М. Вертель [и др.]// Весці Беларус. дзярж. пед. ун–та. Сер. 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. – 2017. – №4(94). – С. 5–10
- [6] А.В. Станчик, С.М. Барайшук [и др.]// Весці НАН Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук». №4, 2016 Р. 67–75
- [7] Tashlykov I.S., Baraishuk S.M. // Russ. J. Non-Ferrous Metals. 2008. V. 49. № 4. P. 303.